

Magistritöö eesmärk oli võrrelda erinevaid kvantitatiivseid prognoosimise meetodeid, kirjeldada meetodite valikuprotseduuri ja selgitada välja parimad meetodid agregeeritud tasemel prognoosimiseks elektroonikatööstuse näitel. Uurimisküsimused, mida magistritöös käsitati, on: millised mudelid annavad agregeeritud andmete korral täpsema prognoosi; kas erinevate riikide ettevõtete puhul toimivad samad mudelid; kas prognoosimisel on oluline arvestada sama tööstusharu teiste ettevõtetega; milliste tingimuste, andmete korral toimib hästi üht või teist tüüpi mudel.

Uurimisobjektideks valitud ettevõtete puhul konstrueeriti libiseva keskmise, eksponentsiaalse silumise, dekompositsiooni, autoregressiivse integreeritud libiseva keskmise ja põhjuslikke mudeleid. Mudeleid võrreldi nende keskmise absoluutse protsentuaalse vea alusel. Poolte vaadeldud ettevõtete puhul andis parima tulemuse mitmene regressioonmudel.

Mudelite täpsust on tõenäoliselt võimalik tõsta, kasutades ka andmeid, mis ei ole avalikest allikatest kättesaadavad. Teised mudelid võivad olla kasulikud, kui ettevõtte ei soovi või ei saa koguda andmeid põhjuslike mudelite tarbeks. Samuti on need heaks tööriistaks konkurentide tulemuste prognoosimisel. Magistritöö esitas üldise protseduuri prognoosimismudeli valikuks ja tõi välja olulised aspektid, millega tuleb mudelite valikul arvestada.